

Normale zur Eichung von Schichtdickenmeßgeräten

Laaneots, Rein; Velling, Ants Metrologia wielkości mechanicznych i kontrola jakości produkcji : symposium metrologia '89, Warszawa, 21-23 czerwca 1989 r. : referaty i komunikaty 1989 / S. 267-274 https://www.ester.ee/record=b4575029*est

Normale zur Eichung von Schichtdickenmeßgeräten

Laaneots, Rein VII. Internationales Oberflächenkolloquium : vom 8. bis 10. Februar 1988 in Karl-Marx-Stadt. Bd. 2: Beschreibung der Poster 1988 / S. 141-144